

# О СВЯЗИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОТОКАТОДА С НАДЕЖНОСТЬЮ ВАКУУМНОГО ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА

Х.Н. ВЕЗИРОВ

Институт Фотоэлектроники АН Азербайджана  
Баку, 370141, ул. Ф.Агаева, 555 квартал

Разработан метод определения сопротивления фотокатода и переходной области, который позволяет прогнозировать долговечность вакуумных фотоэлектронных приборов.

Повышение надежности вакуумных фотоэлектронных приборов является очень актуальной проблемой. Поэтому исследование процессов, приводящих к деградации (потере эффективности фотоэмиссии) фотокатода и связанное с этим определение его электрического сопротивления представляет большой интерес. Однако используемые методы определения сопротивления проводящих пленок на диэлектрических подложках, например, с помощью емкостного датчика, входящего в колебательный контур генератора [1] или связанные с измерением токов и напряжений [2] неточны, а самое главное, не дают возможность определять переходное сопротивление между контактной пленкой (манжетой [3]) и фотокатодом вдоль линии (границе) их соприкосновения.

Исследования же показывают, что определение именно этого переходного сопротивления представляет большой интерес.

родную сплошную пленку (как считалось раньше), периферийная часть которой лежит на манжете, а внутренняя часть - непосредственно на подложке, образуя рабочую область фотокатода. Установлено, что вдоль линии внутренней границы манжеты (т. е. по границе рабочей области фотокатода) эта пленка фотокатода имеет разрывы и трещины. В результате этого (т.е. разрывов) электрическое сопротивление пленки фотокатода в месте соединения с манжетой должно отличаться от сопротивления пленки фотокатода в его рабочей области. При протекании тока через фотокатод, т.е. при работе фотоэлектронного прибора, в случае, если сопротивление перехода намного превышает сопротивление пленки фотокатода в его рабочей области, практически все напряжение, образующееся между центральными областями фотокатода и электрическим выводом прибора падает именно на участке между манжетой и краем рабочей области фотокатода (т.е. на разрыве). Это приводит к возникновению внутри разрыва электрического поля, направленно от фотокатода к манжете (рис. 1).

При рабочих значениях протекающего тока (порядка нескольких микроампер) и сопротивлении перехода порядка нескольких МОм, напряжение  $U$  между границей рабочей области фотокатода и манжетой составит несколько десятков Вольт. Непосредственные измерения ширины разрывов пленки фотокатода микроскопом дают значение порядка 0,1 мкм. Поэтому напряженность электрического поля  $E$  внутри разрыва может превосходить  $10^8$  В/м. Известно, что работа выхода пленки Ag-O-Cs-фотокатода меньше 1 эВ [4], и так как, при таких больших значениях  $E$  снижение работы выхода под действием электрического поля (определенное соотношением  $\Delta e\varphi = 3,79 \cdot 10^4 \cdot E^{1/2}$ ) по абсолютной величине может превосходить даже собственную работу выхода  $e\varphi$ , то внутри разрыва будет возникать значительная автоэлектронная эмиссия. Электроны, эмитированные в область разрыва внутренним краем манжеты, ускоряются электрическим полем внутри разрыва и со средней энергией  $U$  эВ (т.е. несколько десятков эВ) бомбардируют границу рабочей области фотокатода. А так как энергия диссоциации практически всех молекул, из которых состоит Ag-O-Cs-фотокатод, меньше 5 эВ, при работе фотоэлектронного прибора на границе рабочей области фотокатода за счет электронной бомбардировки происходит диссоциация хотя бы некоторых ингредиентов фотокатода. Так, окислы цезия типа  $Cs_xO_y$ , где  $x \leq y$  (например,  $Cs_2O_2$ ) могут восстанавливаться до основного окисла цезия, и даже, до недокисей типа  $Cs_{11}O_3$ . Окислы же серебра могут восстанавливаться до элементарного серебра. При

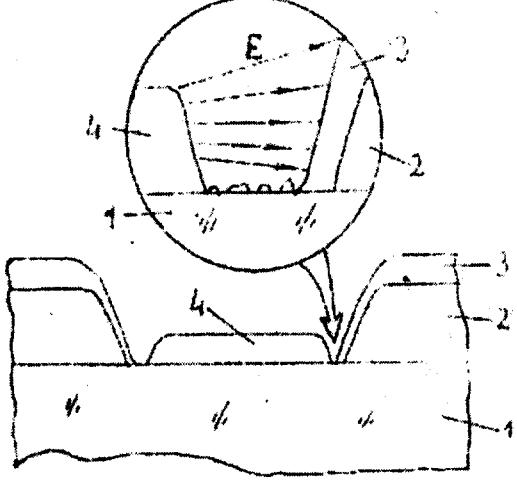


Рис. 1. Возникновение электрического поля внутри разрыва в пленке

Дело в том, что в серийно выпускаемых фотоэлектронных приборах, например, с Ag-O-Cs-фотокатодом, толщина манжеты в несколько раз превышает толщину фотокатода (более 120 нм и порядка 30 нм) и коэффициенты линейного расширения материалов манжеты, фотокатода и подложки сильно различаются. Технология же изготовления фотокатода включает многократные нагревы до 200°C и охлаждения до комнатной температуры. В результате этого, как показали исследования, окончательно изготовленный фотокатод не представляет одно-

этом высвобождающийся кислород может выделяться в газовую фазу и взаимодействуя с поверхностью фотокатода, нарушать его оптимальную структуру и состав, приводя к увеличению работы выхода и потере чувствительности.

Действительно, в экспериментах замечено, что в тех фотоэлектронных приборах с Ag-O-Cs-фотокатодом, в которых начальное переходное сопротивление имело величину нескольких МОм и превышало сопротивление пленки фотокатода в рабочей области, после значительной потери чувствительности на границе рабочей области фотокатода, хотя бы в некоторых местах, образуется визуально заметное изменение цвета, пропорциональное степени деградации (т.е. ширина участков изменения цвета пропорциональна степени деградации и может достигать долей миллиметра, а сам цвет пленки фотокатода в этих местах - желтоватый, напоминает напыленную на стекло пленку неокисленного серебра). То есть, изменение цвета произошло из-за высвобождения кислорода - превращения окислов серебра и цезия до состояния недокисей или даже металлов.

Таким образом, к известным механизмам деградации фотокатодов, таким как ионная бомбардировка фотокатода, натекание газов через микротрешины в объем прибора, газовыделение с внутренних поверхностей прибора, его арматуры, люминофора, фотохимическое разложение фотокатода и др., следует прибавить еще один, связанный с электронной бомбардировкой границы рабочей области фотокатода, приводящий к диссоциации его ингредиентов и высвобождению атомов в объем прибора.

Однако, отсутствие, методов измерения этого переходного сопротивления приводит к необходимости разработки такого метода.

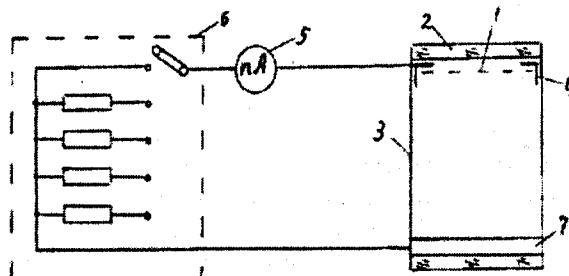


Рис.2. Схема, объясняющая сущность метода

На рис.2 приведена сущность метода. Фотокатод 1 нанесен на подложку 2 фотоэлектронного прибора 3 таким образом, что периферийная часть фотокатода, лежит на манжете 4 (обычная конструкция вакуумных фотоэлектронных приборов). Манжету через измеритель тока 5 соединяют последовательно через магазин сопротивлений 6 с анодом 7 фотоэлектронного прибора. Фотокатод облучают потоком света из области его чувствительности. Луч света при этом представляет в поперечном сечении кольцо. Этот свет направляют на область фотокатода, прилегающую к манжете, но при этом этот свет манжеты не касается. Свет вызывает с фотокатода электронную эмиссию. Этот фототок измеряют при нулевом сопротивлении магазина 6. Затем постепенно увеличивая сопротивление магазина добиваются заметного уменьше-

ния фототока. Измеряют этот фототок. После этого тот же поток света фокусируют в точке в центре фотокатода и измеряют фототок при нулевом сопротивлении магазина и добиваются заметного уменьшения фототока повышением сопротивления магазина. Этот ток также измеряется. Электрическое сопротивление перехода и фотокатода определяют из соотношений:

$$r = R \cdot J / (J_0 - J) \quad (1)$$

$$\rho/h = \pi [(r - R_1) i - r i_0] / (i_0 - i) \quad (2)$$

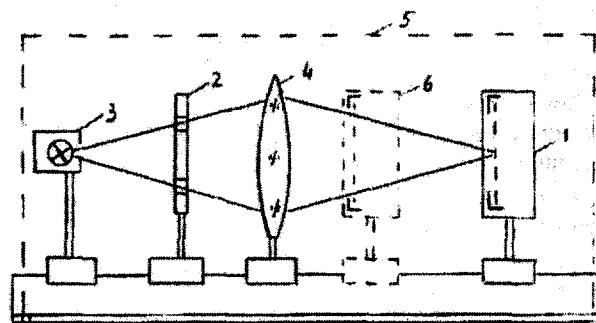
где  $r$ -электрическое сопротивление перехода, Ом;  $\rho/h$ -поверхностное электрическое сопротивление пленки фотокатода, Ом/квадрат;  $J_0$ ,  $J$ -фототок от потока света в виде кольца, соответственно, при нулевом сопротивлении магазина и при сопротивлении магазина, равном  $R_1$ , А;  $R$ -сопротивление магазина, при котором фототок от света в виде кольца упал от  $J_0$  до значения  $J$ , Ом;  $i_0$ ,  $i$ -фототок от сфокусированного в центр луча света, соответственно, при нулевом сопротивлении магазина, и при сопротивлении магазина, равном  $R$ , А;  $R_1$ -сопротивление магазина, при котором фототок от сфокусированного в центре фотокатода луча света упал от  $i_0$  до  $i$ , Ом.

Идея метода заключается в том, что облучение не всей площади фотокатода, а только именно области фотокатода, прилегающей к манжете, потоком в виде узкого кольца, не касающегося манжеты, позволяет исключить фототок со всей пленки фотокатода, т.е. дает возможность определить сопротивление именно перехода манжеты в фотокатод. Подключение же к цепи анод-фотокатод последовательно магазина сопротивлений и гальванометра позволяет изменять общее сопротивление цепи и по изменению тока (связанного с изменением общего сопротивления цепи) сравнивать сопротивление перехода манжета-фотокатод с сопротивлением магазина.

Световой поток, представляющий собой в поперечнике кольцо, легко получить пропуская сплошной поток через непрозрачную диафрагму с кольцевым вырезом. Магазин сопротивлений должен содержать сопротивления от нуля до  $10^9$  Ом. Измерителем тока может служить наноамперметр.

Следует особо подчеркнуть, что схема на рис. 2 не содержит отдельного источника тока. Дело в том, что при облучении фотокатода светом, вызывающим фотоэмиссию, эмиттированные фотоэлектроны сами без "посторонней помощи" летят до анода, создавая тем самым в цепи электрический ток (хотя и малый, но вполне достаточный для измерения). При облучении прилегающей к манжете области фотокатода лучом света в форме кольца возникает фотоэлектронная эмиссия (фотоэлектроны ле-тят на анод, создавая в цепи фототок). Измерив фототок при нулевом сопротивлении магазина, постепенно увеличивая сопротивление магазина, следя за фототоком (свет при этом продолжает падать в виде кольца на приманжетную область фотокатода). При заметном (т.е. достоверном) изменении (уменьшении) фототока (например, на 3%), это значение сопротивления магазина и ток записывают и из соотношения (1) находят величину переходного сопротивления манжета-фотокатод.

Например, первоначальный фототок (при нулевом сопротивлении магазина) был равен  $J_0=90 \cdot 10^{-9}$  А. Фототок упал до значения, скажем,  $J=86 \cdot 10^{-9}$  А (т.е. вполне заметно) при сопротивлении магазина равном  $R=100$  кОм. Следовательно, искомое сопротивление перехода равно  $r=10^5 \cdot 86 \cdot 10^{-9} / (90-86) \cdot 10^{-9} = 2,15$  МОм.



*Рис.3. Измерительная установка*

Затем определяется сопротивление самой пленки фотокатода. Для этого луч света фокусируют в точку, и направляют в центр фотокатода. Этого можно добиться изменением расстояния от фотоэлектронного прибора до диафрагмы (рис.3).

Снова определяют ток при нулевом сопротивлении магазина и увеличивая сопротивление последнего, добиваются заметного уменьшения фототока (луч света непрерывно падает в центр фотокатода), после чего из соотношения (2) определяют сопротивление пленки фотокатода. Например, первоначальное значение фототока при облучении центра фотокатода было равно  $i_0=70 \cdot 10^{-9}$  А. При сопротивлении магазина, равном  $R_1=2 \cdot 10^5$  Ом произошло падение фототока до  $i=65 \cdot 10^{-9}$  А. Учитывая, что сопротивление перехода равно  $r=2,15$  МОм (см. предыдущий пример), из соотношения (2) найдем сопротивление пленки фотокатода:

$$\rho/h=\pi[(2,15 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^5) \cdot 65 \cdot 10^9 - 2,15 \cdot 10^6 \cdot 70 \cdot 10^9] / (70-5) \cdot 10^9 = 1,41 \text{ МОм/квадрат.}$$

И первый, и второй пример взяты из непосредственных измерений фотоэлектронного прибора типа М-9 [2] с серебряно-кислородно-цеиевым фотокатодом. Интересно, что сопротивление самой пленки меньше сопротивления перехода.

Соотношения для расчетов сопротивления получены из следующих соображений. При облучении фотокатода излучением, вызывающим с него фотоэмиссию, между точкой падения излучения и внешним электродом манжеты возникает разность потенциалов, т.к. на месте электронов, покидающих вследствие фотоэмиссии фотокатод остается нехватка зарядов. Собственно пополнение фотокатода электронами (т.е. электрический ток) происходит из-за этой разности потенциалов. Сопротивление току оказывают элементы фотоэлектронного прибора, по которым течет ток, т.е. внешний электрод манжеты, сама манжета, переход манжеты в фотокатод и сам фотокатод. Сопротивлением внешнего электрода манжеты и самой манжеты можно пренебречь, т.к. у них очень хорошая проводимость (внешний электрод обычно изготавливается из платиновой проволоки, а манжета - из достаточно толстой металлической пленки, в результате чего их суммарное сопротивление составляет доли Ома). Таким образом, сопротивление электрическому току оказывает переход манжеты в фотокатод и сам фотокатод. Для исключения сопротивления фотокатода, облучение фотокатода осуществляют не по всей его площади, а лишь в области, прилегающей к манжете, т.е. в виде узкого (тонкого) кольца. При этом вся остальная часть (область) фотокатода остается необлученной. Таким образом, фотоэмиссия происходит лишь с приманжетной области и можно считать, что фототоку оказывает сопротивление лишь переход манжета-фотокатод. Тогда можно написать  $U=J_0 r$ . Если теперь на пути тока поставить еще и дополнительное сопротивление  $R$  (магазин сопротивлений) то, естественно, ток должен уменьшиться и принять значе-

ние  $J$ . Тогда  $U=J(r+R)$ . Приравнивая эти два уравнения, получим:  $J_0 r = J r + J R$  или  $r(J_0 - J) = J R$ . Отсюда для сопротивления перехода можно получить соотношение (1). Теперь, после того, как найдено сопротивление перехода, можно найти сопротивление самого фотокатода. Для этого свет необходимо сфокусировать в точку в центре фотокатода и измерить фототок  $i_0$ , когда сопротивление магазина равно нулю. После этого установить сопротивление магазина таким, чтобы фототок упал до значения  $i$ . Тогда можно написать

$$(r+R_{пл}) i_0 = u' ; (r+R_{пл} + R_1) i = u'$$

Отсюда

$$(r+R_{пл}) i_0 = (r+R_{пл} + R_1) i$$

где  $R_{пл}$  - сопротивление пленки фотокатода от его центра до перехода манжета-фотокатод. Из последнего уравнения можно получить:  $r i_0 + R_{пл} i_0 = r i + R_{пл} i + R_1 i$ ; отсюда

$$R_{пл} = [i(r+R_1) - r i_0] / (i_0 - i) \quad (3)$$

Это значение сопротивления пленки фотокатода, измеренное между центром фотокатода и манжетой не несет большой информационной ценности. Поэтому переведем это сопротивление в поверхностное сопротивление, которое принято измерять в Ом/квадрат [2]. Для этого сперва напишем уравнение сопротивления проводника с удельным сопротивлением  $\rho$ , длиной  $l$  и сечением  $S$ :  $R=\rho l/S$ . Для случая круглого фотокатода толщиной  $h$  можно считать, что общее сопротивление пленки, измеренное между ее центром и внешней окружностью, равно общему сопротивлению параллельно включенных секторов с углом  $d\alpha$ , когда число секторов стремится к бесконечности, а угол  $d\alpha$  при этом стремится к нулю. Тогда

сопротивление одного такого элементарного сектора (рис.4) будет:

$$dR = \rho l / dS = \rho l / (h \cdot x / 2), \text{ где } x = l \cdot \sin(d\alpha).$$

Так как для малых углов синус угла равен самому углу, то  $x = l \cdot d\alpha$ . Тогда  $dS = h l d\alpha / 2$ , а сопротивление элементарного сектора будет равно  $dR = 2\rho / (h d\alpha)$ .

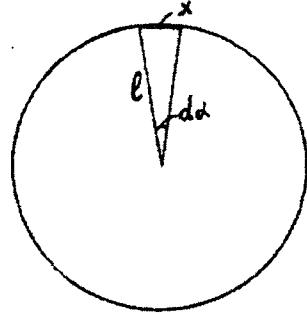


Рис.4. К вычислению сопротивления круглой пленки

Для параллельного соединения сопротивлений общее сопротивление определяется уравнением:

$$1 / R_{общ} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 / dR_n \right).$$

Таким образом, для расчета нам необходимы обратные сопротивления:  $1/dR = (h d\alpha) / 2\rho$ . Проинтегрировав это выражение по всем углам, найдем:

$$1 / R_{общ.} = \int_0^{2\pi} \left( h / 2\rho \right) d\alpha = \left( h / 2\rho \right) \cdot \int_0^{2\pi} d\alpha = \pi h / \rho$$

Вновь взяв обратную величину, найдем  $R_{общ} = \rho / \pi h$ , т.е.  $\rho / h = \pi R_{общ}$ . Таким образом, для нахождения поверх-

ностного сопротивления необходимо полученное из измерений сопротивление (3) умножить на  $\pi$ .

Разработанный метод позволяет также прогнозировать явно недолговечные приборы. Это такие приборы, в которых, во-первых, сопротивление перехода в несколько раз (5 и более раз) превышает сопротивление пленки фотокатода в его рабочей области. Это условие необходимо для того, чтобы напряжение, возникающее вследствие протекания фототока, падало в основном на переходе (разрыве фотокатода). Второе условие определяется из соотношения  $D < JR$ , где  $D$  - максимальная энергия диссоциации для молекул фотокатода, эВ;  $J$  - величина фототока, А;  $R$  - сопротивление перехода, Ом. Так, для Ag-O-Cs-фотокатода  $D$  меньше 5 эВ. Если ток через фотокатод будет в данном приборе иметь величину 2 мкА, то сопротивление  $R$ , необходимое для того, чтобы работал указанный механизм деградации составит  $5B/2 \cdot 10^6 A = R$ , т.е.  $R$  должно быть больше  $2,5 \cdot 10^6$  Ом. Если же, ток будет 10 мкА, то  $R$  для такого тока должен быть  $5 \cdot 10^5$  Ом. Другими словами, если имеется прибор, в котором переходное сопротивление равно, скажем, 5 МОм и оно, скажем, в 10 раз превышает сопротивление фотокатода, то значение тока через фотокатод, при котором будет происходить диссоциация молекул фотокатода, и, стало быть, долговечность прибора будет низкой, будет равно  $J = 5B/5 \cdot 10^6$  Ом =  $1 \cdot 10^{-6}$  А = 1 мкА. Т.е., при токах больших 1 мкА в этом приборе кроме других механизмов деградации будет наблюдаться также и деградация фото-катода, связанная с диссоциацией его молекул в разрыве, вызванная электронной бомбардировкой. Таким образом, при токах больших 1 мкА долговечность этого прибора будет низкой.

Разработанный метод успешно используется в производстве электронно-оптических преобразователей для отбора явно недолговечных изделий.

- [1] Авт. свид. СССР № 467300, 1975.  
[2] М.М. Бутслов, Б.М. Степанов, С.Д. Фанченко. Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях. М., Наука, 1978, с. 478.

- [3] В. Гартманн, Ф. Бернгард. Фотоэлектронные умножители. М.-Л., Госэнергоиздат, 1961, с.48.  
[4] В.С. Фоменко. Эмиссионные свойства материалов. Справочник. Киев, Наукова думка, 1981, с.223.

H. N. Vəzirov

## KATODUN MÜQAVİMƏTİ İLƏ VAKUUM FOTOELEKTRON CİHAZININ E'TİBARLILIĞI ARASINDA ƏLAQƏ HAQQINDA

Fotokatodun ve keçid sahəsinin müqavimətinin te'yin edilməsinin elə metodu işlənmişdir ki, vakuum fotoelektron cihazlarının e'tibarlılığını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Kh.N. Vezirov

## ON THE CONNECTION BETWEEN PHOTOCATHODE RESISTANCE AND RELIABILITY OF A VACUUM PHOTOELECTRON DEVICE

The method for determination of the resistance of photocathode and transition region is suggested, which allows forecast reliability of vacuum photoelectron devices.

Дата поступления: 08.01.01

Редактор: А.М. Гашимов